國立交通大學電子物理研究所

碩士論文

氮化鎵薄膜表面能態密度分佈之研究 Surface state density profiles of GaN using C-V measurement

研究生:高銘遜

指導教授:陳衛國 教授

中華民國九十三年六月

氮化鎵薄膜表面能態密度分佈之研究

Surface state density profiles of GaN using C-V measurement

研究生:高銘遜 Student: Ming-Hsun Kao

指導教授: 陳衛國 教授 Advisor: Prof. Wei-Kuo Chen



A Thesis
Submitted to Institute of Electrophysics
College of Science
National Chiao Tung University
in Partial Fulfillment of the Requirements
for The Degree of Master of Physics
in

Electrophysics
June 2004
Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十三年六月